

NPS

PN CHECKER

シリコン用 PN判定器

MODEL PN-01

MODEL PN-01は、シリコンウェーハまたはシリコンインゴットのPタイプ、Nタイプを簡単に判定することができます。整流性方式と熱起電力方式を両用することにより、幅広い抵抗率範囲での使用ができます。また、ウェーハは、PオンNやNオンPの判定ができます。

MODEL PN-01 consists of compact circuit box and two detecting probes. Simple, Sensitive and handy tool ensures faster response for checking mono-crystal silicon wafer and ingot as below.

This unit can distinguish a test material between P type and N type by buzzer sound. At the same time, result will be shown on the LED.



整流性方式プローブ
Pin probe for silicon wafer



熱起電力方式プローブ
Hot probe for silicon ingot

仕様

判定可能な試料特性	シリコンウェーハ、インゴットのPまたはNタイプ
抵抗率範囲	0.001Ω-cm ~ 1500Ω-cm (整流性方式は1Ω-cm以上推奨)
整流性方式	主にシリコンウェーハ用
熱起電力方式	主にインゴット、バルク用
電源	100VAC 50/60Hz
寸法/重量	本体 225W×150D×80H (mm) 2kg

使用方法

ウェーハ用：判定したいウェーハの面をステージにのせ、軽く押さえ付けるだけでウェーハにダメージを与えず、簡単にPNの判定ができます。

インゴット用：ホットプローブを試料面に押し当てるだけで、簡単にPNの判定ができます。

Specification

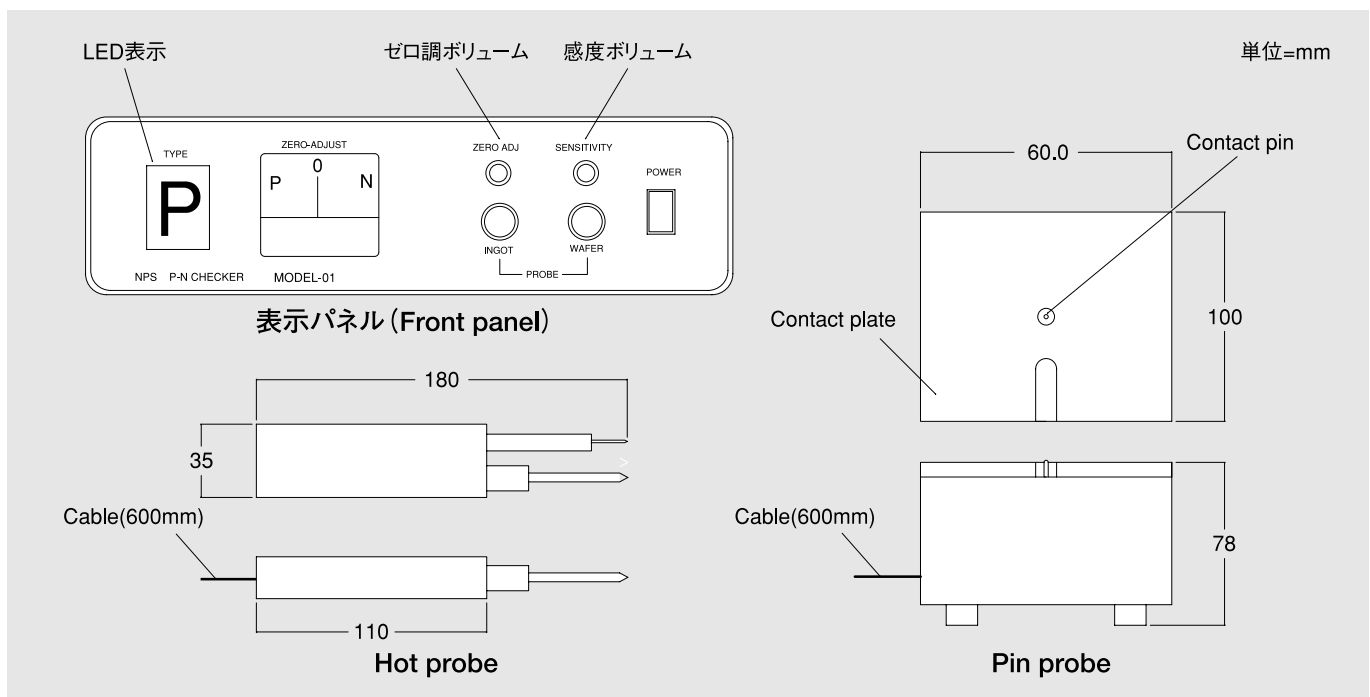
Dopants	P-type(B;Boron P+) N-type(P;Sb)
Resistivity range	0.001Ω-cm ~ 1500Ω-cm (minimum 1Ω-cm for Pin probe)
Pin probe	For wafer as-cut, polished, lapped, P on N or N on P
Hot probe	For bulk, ingot
Power	100VAC 50/60Hz
Physical data	225W×150D×80H (mm) 2kg

Operation

For wafer : By placing test wafer on sensing pin on top of stage box and just touching.

For ingot : Grip the hot probe and just touching to surface of the ingot or bulk.

外観図 Configuration



NPS <http://www.nps-i.co.jp>

新精密技術を追求する!

エヌピーエス株式会社 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-12-4 TEL. 03-3684-2548 FAX. 03-3684-2287

NPS, INC. 6-12-4 Kameido Koto-ku Tokyo 136-0071 Japan Phone: 81-3-3684-2548 Fax: 81-3-3684-2287

